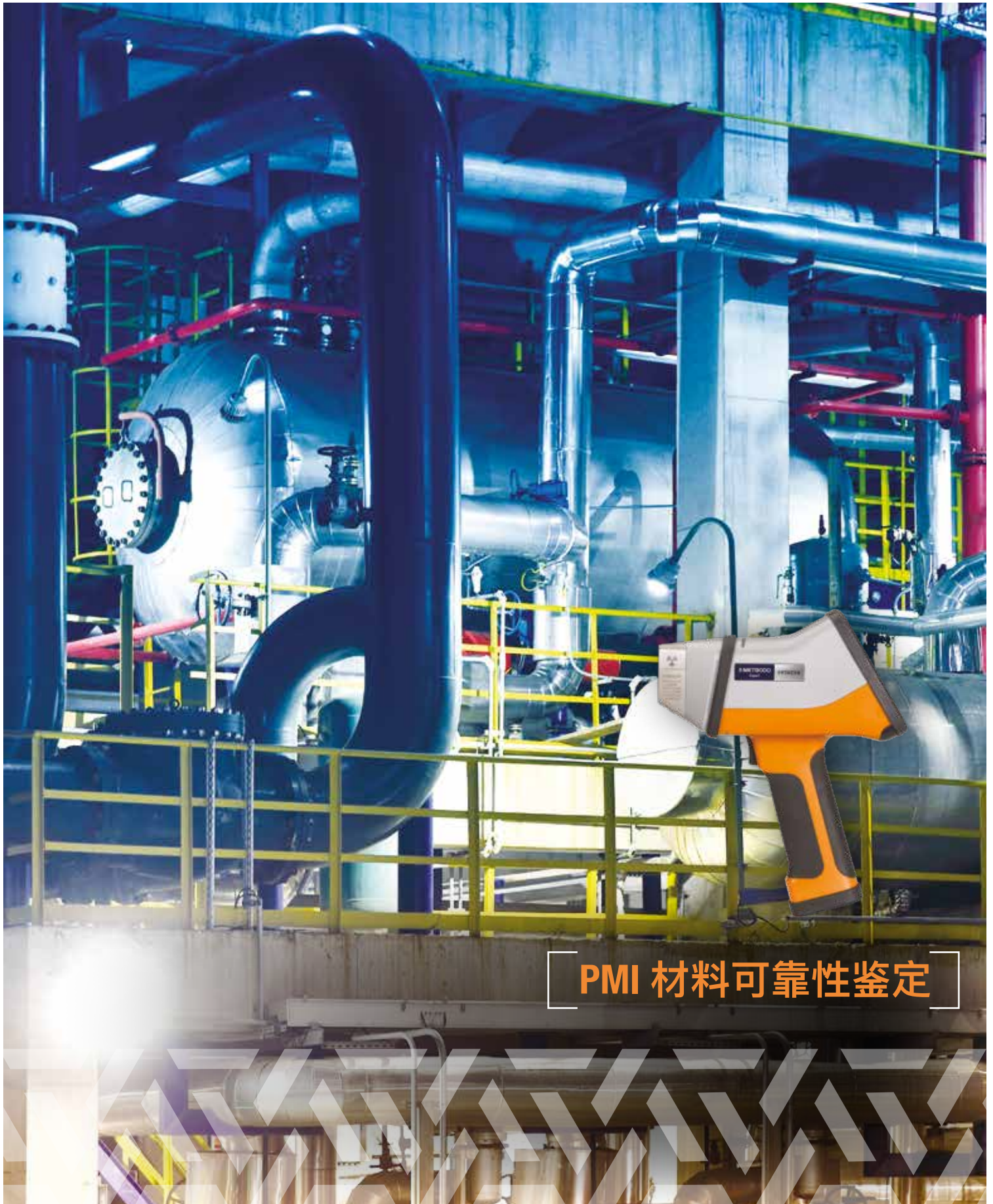


X-MET8000

HITACHI

Inspire the Next

日立



PMI 材料可靠性鉴定

X-MET8000 是一款手持式 X 射线荧光 (XRF) 光谱仪，为安全攸关的应用场合带来出色的现场合金分析。

该分析仪具备轻便性，采用了符合人体工学的设计，因此操作舒适，适合日常使用。其优化的机头设计可轻松测试弯曲或拐角内部的材料。得益于我们独有的 HERO™（耐热）窗口，您可准确分析温度高达 400°C 的合金。

借助 X-MET8000，您可最大限度减少实验室检测工作，并降低成本，同时确保安全性和合规性。



为什么 X-MET8000 是您企业的理想之选？



分析结果值得您信任

X-MET8000 完美结合了通用的基本参数 (FP) 方法和经验系数法 (可溯源的标准物质)，可提供超高的分析精密度和准确度。



性能优异

该分析提供的出色轻元素 (Mg 至 S) 分析可对组件及系统进行严格控制。检测限制低，可准确分析微量元素/残存元素以及识别牌号。



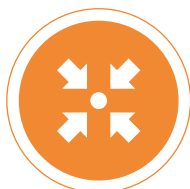
易于操作

直观的图标驱动式用户显示意味着操作员几乎不需任何培训。大屏幕方便操作员阅读，且可在穿戴手套的情况下操作。无需使用任何工具便可更换已损坏或沾污的可快速更换防护窗口。



稳健

X-MET8000 具备 IP54 防护等级 (相当于 NEMA3)，有着超高的防尘和防水性能。该分析仪符合 MIL-STD-810G 军用级强度标准。



可选准直器

可选的小点准直器 (3 毫米直径)，用于更加准确地分析特点区域 (如焊料)，不受周边材料干扰。

结构旨在经久耐用

X-MET8000 具有耐冲击外壳，且在显示屏、仪器头部及电池周围均采用环保密封和减震橡胶，可有效防止受到撞击。采用大面积散热器，即便在高温环境下也能提供理想的可靠性和稳定性。防护窗口（Expert 及 Optimum 型号的选购件）和高强度厚 Kapton® 窗口（Smart 型号）可防止探头和X射线管在测试小部件与尖锐物品时受损。

强大的数据管理功能

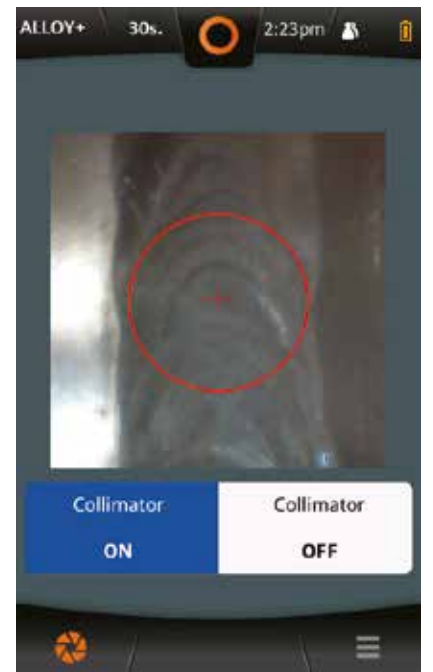
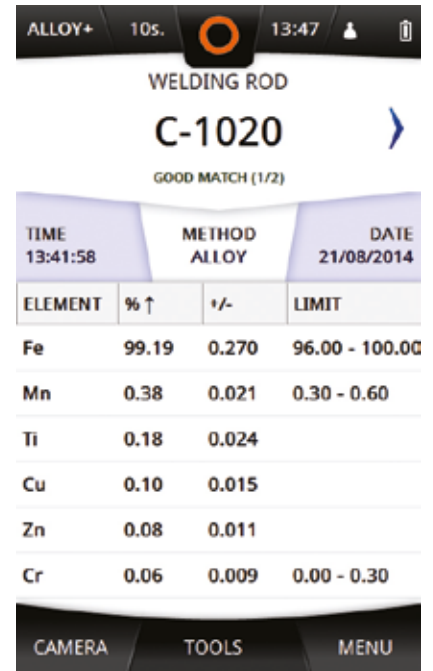
可存储多达十万个检测结果，包括光谱谱图和样品图像（若配备相机）结果和报告可直接下载到 U 盘，或通过 USB 数据线传到 PC 上，也可利用 WiFi 或蓝牙实现网络共享；可保存成 CSV 格式或防篡改的 PDF 格式，以确保数据完整性。使用 X-MET 报告生成器创建自己的报告（无需安装任何软件）。此类报告可以包括公司徽标、样品图像、分析结果、光谱图和额外的样品信息。借助我们的应用，您可以与供应商、客户或同事实时分享分析结果。

全面的、可自定义的牌号库

X-MET8000 内含有最全面的牌号库：预安装的、用户可选的 AISI、DIN、JIS 和 GB 牌号库覆盖超过 1600 种合金。用户可对现有牌号库进行修改，添加新牌号（例如某个厂商或者产地特定牌号），或者创建自己的牌号库（例如特定的焊接材料牌号库）。

预装牌号库包括：

- | 镍合金
- | 低合金钢
- | 不锈钢
- | 工具钢
- | 铜合金
- | 钛合金
- | 铝合金
- | 锆合金
- | 钴合金
- | 等...



配置选项



	X-MET8000 Smart	X-MET8000 Optimum	X-MET8000 Expert
说明	对常用合金进行常规鉴别和分析的明智选择	经过优化，可快速分拣及分析合金，从铝到铜、再到不锈钢等	旗舰产品，性能优异，可精确分析轻元素 (Mg、Al、Si、P、S)、杂质元素及痕量元素
X 光管	40 千伏	40 千伏或 50 千伏（取决于具体的应用）	50 千伏
X 光管过滤器	单个过滤器	6 位过滤器，适用于从 Mg 至 U 的所有元素的优化分析	
探测器	大面积硅漂移探测器	大面积硅漂移探测器	大面积硅漂移探测器
元素范围	K - U	Mg - U	
最大样品温度	400°C	100°C 400°C，带 HERO™（耐热）窗口（选购件）	
IP54 等级	是	是	是
重量	1.5 千克	1.5 千克	1.5 千克
电池续航能力	10 - 12 小时	10 - 12 小时	10 - 12 小时
保护探测器窗口不受损坏	厚 Kapton® 窗口	可选窗口保护罩	
校准	无标样FP法	无标样FP法（含轻元素分析）	无标样FP法 + 自动选择经验校准（可溯源的标准物质），可提供高精度及高准确度

可选硬件和软件

功能	X-MET8000 Smart	X-MET8000 Optimum	X-MET8000 Expert
蓝牙	包含	包含	包含
WiFi	包含	包含	包含
集成摄像头	可选	可选	包含
小点准直器	不包含	可选	可选
报告生成器	包含	包含	包含

可获最大生产力及操作员安全的可选附件

便携式蓝牙打印机：

将结果打印在纸上或不干胶标签上，然后将其粘贴至被测件上，既方便又可自由组合。



保护套与皮带：

用于现场免提运送分析仪。



台式支架：

数秒内将 X-MET8000 变身成台式分析仪。测量不规则形状物品时提高生产力以及增强操作安全性。大样品舱可测量各种形状和尺寸的样品。

轻质支架与安全罩：

用于分析小样品（如螺钉、紧固件）；可放进X-MET手提箱便于携带。



轻便防辐射罩：

当分析轻元素（如铝合金）时，防止辐射泄露。

蓝牙条形码扫描仪：

可防止使用 X-MET 用户界面时，样品标签和其他信息输入错误。只需扫描样品条形码，即可在 X-MET 屏幕上的所选字段中填入信息。



我们的服务

我们的全球服务中心提供全方位的技术支持。



技术服务台

对您的问题快速解答。



在线诊断

通过互联网提供深入支持。



仪器租赁

当您的分析仪不工作时，您也能正常工作。



再认证与维护

确保您的分析仪能够年复一年地提供正确结果。



培训

了解您的分析仪及其功能。



延长保修期

降低计划外成本。



耗材与附件

从备用电池至台式支架。



维修

实现高效快速周转。

下一步

立即通过 contact@hitachi-hightech-as.com
联系我们的专家，安排样机演示。

更多信息

如需了解有关 X-MET8000 光谱仪系列的
更多内容，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha



其他产品

我们为工业行业提供分析产品已有 40 多年。

- | **Vulcan:** 最新技术，可在 1 秒内识别合金，且不使用 X 射线。
- | **移动式 and 便携式 OES:** 高效能的合金元素、微量元素分析；以及双相钢中的氮含量分析。

可在 www.hitachi-hightech.com/hha
中浏览我们的全系列产品

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science 所有。本出版物仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science 承认所有商标和注册。

Hitachi High-Tech Analytical Science
版权所有，2017 年。保留所有权利。

 Science for
a better tomorrow